

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Том 47, номер 3, 2018

---

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Влияние дозы экспонирования на стойкость негативного электронного резиста HSQ в процессах плазмохимического и химического травления  
*А. В. Мяконьких, Н. А. Орликовский, А. Е. Рогожин, А. А. Татаринцев, К. В. Руденко* 179
- 

## ДИАГНОСТИКА

- Гелиевые пузыри в слоях Si(001) после высокодозовой имплантации и термического отжига  
*А. А. Ломов, А. В. Мяконьких, Ю. М. Чесноков* 187
- Лазерная методика оценки параметров чувствительности бис к эффектам воздействия отдельных заряженных частиц  
*А. И. Чумаков* 198
- Геометрические эффекты в вольт-амперной зависимости крестообразной МДМ-структуры Ni/NiO/Fe  
*И. В. Маликов, В. А. Березин, Л. А. Фомин, Г. М. Михайлов* 205
- Магнитно-силовая микроскопия нанопроволок железа и никеля, полученных методом матричного синтеза  
*Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, Р. И. Хайбуллин, Н. М. Лядов, Д. Л. Загорский, С. А. Бедин, И. М. Долуденко* 212
- Исследование динамических характеристик высокотемпературных элементов КНИ КМОП СБИС  
*А. С. Бенедиктов, Н. А. Шелепин, П. В. Игнатов, А. А. Михайлов, А. Г. Потупчик* 222
- 

## МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Расчёт высокочастотной электропроводности тонкого металлического слоя в случае эллипсоидальной поверхности Ферми  
*И. А. Кузнецова, Д. Н. Романов, А. А. Юшканов* 226
- Расчет АЧХ МЭМС-микрофона с помощью конечно-элементного моделирования  
*Д. М. Григорьев, И. В. Годовицын, В. В. Амеличев, С. С. Генералов* 238
- Расчётно-экспериментальная оценка надёжности глубокосубмикронных КНИ МОП-транзисторов при высоких температурах  
*А. С. Бенедиктов, Н. А. Шелепин, П. В. Игнатов* 244
-